



Лазерные профилометры серии AN-x2TL



Принцип работы

Излучение полупроводникового лазера формируется в виде линии и проецируется на объект. Рассеянное на объекте излучение объективом собирается на двумерной CMOS-матрице. Полученное изображение контура объекта анализируется сигнальным процессором, который рассчитывает расстояние до объекта (координата Z) для каждой из множества точек вдоль лазерной линии на объекте (координата X).

Сканер предназначен для бесконтактного измерения и контроля профиля поверхности, положения, перемещения, размеров, определения дефектов объекта и построения карты их расположения, распознавания технологических объектов, построения 3D моделей.

Спецификация

Модель		AN-x2TL-50	AN-x2TL-300	AN-x2TL-600
Лазер	Тип	Красный, зеленый, инфракрасный, синий полупроводниковый лазер		
	Длина волны	405, 532, 658 (по умолчанию), 808 нм		
	Класс лазерной безопасности	Класс 3	Класс 3	Класс 3
	Выходная мощность	10 мВт	80 мВт	100 мВт
Рабочий диапазон *	Z-axis (Height)	20**..200 мм	150..600 мм	500..1200** мм
Линейность (погрешность), Z-axis		0.05% от диапазона		
Частота измерений		AN-02TL с базовой частотой 250 Гц AN-12TL с базовой частотой 60 Гц AN-32TL с базовой частотой 1000 Гц		
Температурные характеристики		При изменении на 1°C характеристики изменяются на 0.01%		
Устойчивость к внешним воздействиям	Окружающая температура	0 ... +55°C		
	Относительная влажность	20 ... 85% RH (без конденсации)		
	Уровень вибраций	10 ... 57 Гц, 1,5 мм двойной амплитуды в направлениях X, Y и Z, 3 часа соответственно		
	Ударные нагрузки	15 г / 6 мс		
Вес		Ip67 (IEC60529)		
Материал корпуса		Алюминий		
Вес		около 400 г	около 500 г	около 1300 г

*базовое расстояние и рабочий диапазон по оси X уточняются при заказе

**данное значение может быть изменено при заказе